

# 粉末·液体样品分析 -- 薄膜·纳米材料分析

**D/max-Ultima III/TTR III** 型仪器配备了理学公司独创的入射光学系统（交叉光路系统），1 台仪器即可进行从普通粉末样品到包括 In-Plane 测试在内的薄膜样品等多种多样的分析。采用组合型构成方式，通过对各个单元的不同组合，可以进行各种测试。特别是 D/max-TTR III 型仪器，通过与 18KW 大功率 X 射线发生器组合，实现高精度快速分析。

## 交叉光路系统（CBO）

交叉光路系统（Cross Beam Optics）是具有划时代意义的入射光学系统，可以快速便捷的转换聚焦法、多层膜产生的平行光路、以及小角散射、微区、反射率、薄膜高分辨率、In-Plane 等各种光学系统。（除聚焦法以外均为选件）

（专利号：3548556）

## 根据需要进行组合

根据测试目的选择光学系统单元及附件，扩展仪器功能，灵活对应各种分析要求。

## 采用高精度、高强度样品水平测角仪

采用最小步进角度  $1/10000'$  的高强度测角仪。由于样品为水平放置，不用考虑测试对象的状态。不用固定样品，无需担心固定材料带来的污染及应力影响。



交叉光路系统



小角散射测试



多用途薄膜测试



In-Plane 测试

## D/max-Ultima III

组合型多功能 X 射线衍射仪  
Multi purpose X-Ray Diffractometer



## D/max-TTR III

样品水平型大功率 X 射线衍射仪  
Theta Rotating anode X-Ray Diffractometer

